

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学内利用 利用者測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目	単位	料金(円)
全機種共通	ライセンス試験料	0.5 hr	500
	測定サポート料	0.5 hr	500
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400A	基本利用料	0.25 hr 250
	ECS400B	基本利用料	0.5 hr 500
	ECX400, ECA500	基本利用料	0.5 hr 500
		長時間利用料(24時間毎に)	9~24 hr 9,000
	ECZ600R	基本利用料	0.5 hr 600
		長時間利用料(24時間毎に)	9~24 hr 10,800
パルスNMR	MU25	基本利用料	1 hr 400
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	LC,GC基本利用料	1 hr 1,200
		LC,GC長時間利用料(8時間毎加算)	8~16 hr 4,000
X線回折装置(XRD)	APEX II	基本利用料	1 hr 1,200
		年間利用料	1 講座・年 100,000
	ULTRA	基本利用料	1 hr 1,400
		年間利用料	1 講座・年 120,000
	D8 ADVANCE	基本利用料	0.5 hr 400
	共通	CSD年間利用料	1 講座・年 60,000
電界放射型透過電子顕微鏡 (FE-TEM)	年間登録料	1 人・年	150,000
	年間登録料(同一講座2人目以降)	1 人・年	50,000
	基本利用料(登録有)	1 day	5,000
	低温測定利用料(登録有)	1 day	7,500
	Cryo-TEM利用料(登録有)	1 day	10,000
	基本利用料(登録無)	1 day	30,000
走査型電子顕微鏡(SEM)	基本利用料	0.5 hr	300
	EDS利用料	0.5 hr	500
	長時間利用料(Cryo-SEM用)		
顕微分光光度計	基本利用料	0.5 hr	400
顕微赤外分光光度計(顕微IR)	基本利用料	0.5 hr	400
紫外可視近赤外分光光度計	基本利用料	0.5 hr	300
蛍光寿命測定装置	基本利用料	0.5 hr	300
発光量子収率測定装置	基本利用料	0.5 hr	400
ゼータ電位・粒径測定装置	基本利用料	0.5 hr	400
	固体表面測定料		
	固体表面測定標準試料使用料	1 回	3,000
分析HPLC	基本利用料	1 hr	200
精密イオンポリッシング装置	基本利用料	24 hr	500
金イオンコータ	基本利用料	1 hr	200
ソフトプラズマエッチング装置	基本利用料	1 hr	200
マイクロ電子天びん	基本利用料(元素分析以外)	0.5 hr	100
グローブボックス	基本利用料(元素分析以外)	0.5 hr	300
電子スピン共鳴装置(ESR)	基本利用料	0.5 hr	300
電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	基本利用料	0.5 hr	600
オスミウムコータ	基本利用料	1 hr	400
透過型電子顕微鏡(TEM)	基本利用料	24 hr	4,000
	使用取扱説明会受講料	1 回	30,000
薄膜X線回折装置(薄膜XRD)	基本利用料	1 hr	1,000

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学内利用 依頼測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目		単位	料金(円)
全機種共通	測定サポート料		0.5 hr	500
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400B, ECX400, ECZ600R	依頼測定料 (^1H , ^{19}F)	1 件	1,000
		依頼測定料 (^{13}C)	1 件	3,000
		依頼測定料 (溶液特殊)	1 件	10,000
		依頼測定料 (固体)	1 件	20,000
		依頼試料調製料	1 件	2,000
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	依頼測定料 (精密質量測定)	1 件	1,200
		依頼測定料 (イオン化法変更再測定)	1 件	500
		依頼測定料 (FD,FI,EI 通常測定)	1 件	600
	Orbitrap	前処理ライセンス講習料	1 人	5,000
		依頼測定料 (登録無, タンパク質同定)	1 件	15,000
		依頼測定料 (登録有, タンパク質同定)	1 件	3,000
		年間登録料	1 講座・年	150,000
X線回折装置(XRD)	APEX II, ULTRA	依頼測定料	1 件	40,000
	D8 ADVANCE	依頼測定料	1 hr	2,400
元素分析装置	依頼測定料 (通常試料)		1 回	1,100
	依頼測定料 (特殊試料)		1 回	1,600
	依頼測定料 (グローブボックス利用)		1 件(2 回)	4,400
	依頼測定料 (秤量依頼の場合)			各上記2倍
電界放射型透過電子顕微鏡 (FE-TEM)	依頼測定料		1 day	60,000
	Cryo-TEM依頼測定料		1 day	120,000
薄膜X線回折装置(薄膜XRD)	依頼測定料		1 hr	2,000

※学内利用の料金です。学外利用とは利用できる機器や料金が異なりますので、ご注意下さい。

※その他、詳細な料金規定については、センター (cai-network@chiba-u.jp) にお問い合わせ下さい。

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学外学術利用 利用者測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目		単位	料金(円)
全機種共通	ライセンス試験料		0.5 hr	800
	測定サポート料		0.5 hr	800
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400B	基本利用料	0.5 hr	700
	ECX400, ECA500	基本利用料	0.5 hr	700
		長時間利用料 (24時間毎に)	9~24 hr	12,600
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	LC,GC 基本利用料	1 hr	1,800
		LC,GC 長時間利用料 (8時間毎加算)	8~16 hr	6,000
X線回折装置(XRD)	APEX II	基本利用料	1 hr	1,800
	ULTRA	基本利用料	1 hr	2,100
	D8 ADVANCE	基本利用料	0.5 hr	600
電界放射型透過電子顕微鏡 (FE-TEM)	年間登録料		1 人・年	225,000
	年間登録料(同一講座2人目以降)		1 人・年	75,000
	基本利用料(登録有)		1 day	7,500
	低温測定利用料(登録有)		1 day	12,000
	基本利用料(登録無)		1 day	45,000
走査型電子顕微鏡(SEM)	基本利用料		0.5 hr	500
	EDS利用料		0.5 hr	800
	長時間利用料(Cryo-SEM用)			
顕微分光光度計	基本利用料		0.5 hr	600
顕微赤外分光光度計(顕微IR)	基本利用料		0.5 hr	600
紫外可視近赤外分光光度計	基本利用料		0.5 hr	500
蛍光寿命測定装置	基本利用料		0.5 hr	500
発光量子収率測定装置	基本利用料		0.5 hr	600
ゼータ電位・粒径測定装置	基本利用料		0.5 hr	600
	固体表面測定料			
	固体表面測定標準試料使用料		1 回	4,500
金イオンコータ	基本利用料		1 hr	300
ソフトプラズマエッチング装置	基本利用料		1 hr	300
マイクロ電子天びん	基本利用料(元素分析以外)		0.5 hr	200
グローブボックス	基本利用料(元素分析以外)		0.5 hr	500
電子スピン共鳴装置(ESR)	基本利用料		0.5 hr	500
電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	基本利用料		0.5 hr	900
オスミウムコータ	基本利用料		1 hr	600
透過型電子顕微鏡(TEM)	基本利用料		24 hr	6,000
	使用取扱説明会受講料		1 回	45,000

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学外学術利用 依頼測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目		単位	料金(円)
全機種共通	測定サポート料		0.5 hr	800
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400B, ECX400, ECZ600R	依頼測定料 (^1H , ^{19}F)	1 件	1,500
		依頼測定料 (^{13}C)	1 件	4,500
		依頼測定料 (溶液特殊)	1 件	15,000
		依頼測定料 (固体)	1 件	30,000
		依頼試料調製料	1 件	3,000
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	依頼測定料 (精密質量測定)	1 件	1,800
		依頼測定料 (イオン化法変更再測定)	1 件	700
		依頼測定料 (FD,FI,EI 通常測定)	1 件	900
	Orbitrap	依頼測定料 (タンパク質同定)	1 件	30,000
X線回折装置(XRD)	APEX II, ULTRA	依頼測定料	1 件	50,000
	D8 ADVANCE	依頼測定料	1 hr	3,600
元素分析装置	依頼測定料 (通常試料)		1 回	1,700
	依頼測定料 (特殊試料)		1 回	2,400
	依頼測定料 (秤量依頼の場合)			各上記2倍
電界放射型透過電子顕微鏡(FE-TEM)	依頼測定料		1 day	90,000

※学外学術利用（他大学・公的研究機関等）の料金です。学内および学外一般利用（企業等）とは利用できる機器や料金が異なりますので、ご注意下さい。

※その他、詳細な料金規定については、センター（cai-network@chiba-u.jp）にお問い合わせ下さい。

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学外一般利用 利用者測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目		単位	料金(円)
全機種共通	ライセンス試験料		0.5 hr	2,500
	測定サポート料		0.5 hr	2,500
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400B	基本利用料	0.5 hr	2,000
	ECX400, ECA500	基本利用料	0.5 hr	2,000
		長時間利用料 (24時間毎に)	9~24 hr	40,000
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	LC,GC 基本利用料	1 hr	7,500
X線回折装置(XRD)	APEX II	基本利用料	1 hr	6,000
	ULTRA	基本利用料	1 hr	7,000
	D8 ADVANCE	基本利用料	0.5 hr	2,000
電界放射型透過電子顕微鏡 (FE-TEM)	年間登録料		1 人・年	300,000
	年間登録料(同一部署2人目以降)		1 人・年	100,000
	基本利用料		1 day	40,000
	低温測定利用料		1 day	60,000
走査型電子顕微鏡(SEM)	基本利用料		0.5 hr	1,500
	EDS利用料		0.5 hr	2,500
	長時間利用料(Cryo-SEM用)			
顕微分光光度計	基本利用料		0.5 hr	2,000
顕微赤外分光光度計(顕微IR)	基本利用料		0.5 hr	2,000
紫外可視近赤外分光光度計	基本利用料		0.5 hr	1,500
蛍光寿命測定装置	基本利用料		0.5 hr	2,000
発光量子収率測定装置	基本利用料		0.5 hr	2,000
ゼータ電位・粒径測定装置	基本利用料		0.5 hr	2,000
	固体表面測定料			
	固体表面測定標準試料使用料		1 回	15,000
金イオンコータ	基本利用料		1 hr	1,000
ソフトプラズマエッチング装置	基本利用料		1 hr	1,000
マイクロ電子天びん	基本利用料(元素分析以外)		0.5 hr	500
グローブボックス	基本利用料(元素分析以外)		0.5 hr	1,500
電子スピン共鳴装置(ESR)	基本利用料		0.5 hr	1,500
電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	基本利用料		0.5 hr	3,000
オスミウムコータ	基本利用料		1 hr	2,000
透過型電子顕微鏡(TEM)	基本利用料		24 hr	20,000
	使用取扱説明会受講料		1 回	150,000

共用機器センター管理機器 利用料金表
【学外一般利用 依頼測定】

2018年6月1日より

※2018年6月からの追加・改定部分を赤字で表示。

機器	機種・項目		単位	料金(円)
全機種共通	測定サポート料		0.5 hr	2,500
核磁気共鳴装置(NMR)	ECS400B, ECX400, ECZ600R	依頼測定料 (¹ H, ¹⁹ F)	1 件	5,000
		依頼測定料 (¹³ C)	1 件	15,000
		依頼測定料 (溶液特殊)	1 件	50,000
		依頼測定料 (固体)	1 件	80,000
		依頼試料調製料	1 件	10,000
質量分析装置(MS)	AccuTOF, Exactive	依頼測定料 (精密質量測定)	1 件	7,500
		依頼測定料 (イオン化法変更再測定)	1 件	1,000
		依頼測定料 (FD,FI,EI 通常測定)	1 件	4,000
	Orbitrap	依頼測定料 (タンパク質同定)	1 件	75,000
X線回折装置(XRD)	APEX II, ULTRA	依頼測定料	1 件	200,000
	D8 ADVANCE	依頼測定料	1 hr	12,000
元素分析装置	依頼測定料 (通常試料)		1 回	5,500
	依頼測定料 (特殊試料)		1 回	8,000
	依頼測定料 (秤量依頼の場合)			各上記2倍
電界放射型透過電子顕微鏡(FE-TEM)	依頼測定料		1 day	200,000

※学外一般利用(企業等)の料金です。学内および学外学術利用(他大学・公的研究機関等)とは利用できる機器や料金が異なりますので、ご注意下さい。

※その他、詳細な料金規定については、センター(cai-network@chiba-u.jp)にお問い合わせ下さい。